【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成25年3月14日(2013.3.14)

【公開番号】特開2012-169233(P2012-169233A)
【公開日】平成24年9月6日(2012.9.6)
【年通号数】公開・登録公報2012-035
【出願番号】特願2011-31516(P2011-31516)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｊ　37/22　　(2006.01)
Ｈ０１Ｊ　37/153　　(2006.01)
Ｈ０１Ｊ　37/20　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｊ　37/22　　５０２Ｈ
Ｈ０１Ｊ　37/153　　Ｂ
Ｈ０１Ｊ　37/20　　Ｄ
Ｈ０１Ｊ　37/20　　Ｃ
Ｈ０１Ｊ　37/153　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成25年1月30日(2013.1.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
観察するための試料を搭載し、移動して試料の観察位置を変更することのできる試料台を備えた荷電粒子顕微鏡と荷電粒子顕微鏡で計測した信号を画像として取得する画像入力装置と、入力した画像を保存するための記憶装置と、画像に処理を施し種々の補正を行うための演算装置と補正を行う条件を入力するための入力装置と、補正を行った画像を出力するための出力装置を備えた荷電粒子顕微鏡システムにおいて、
試料観察中に発生する試料台の移動に起因する観察画像の歪を当該観察画像のライン単位で検出し、検出した前記歪をライン単位で補正して、前記歪を軽減した画像を出力することを特徴とする荷電粒子顕微鏡システム。
【請求項２】
請求項１に記載の荷電粒子顕微鏡システムにおいて、
１枚の観察画像の歪を補正するために、補正用参照画像を１枚取得することを特徴とする荷電粒子顕微鏡システム。
【請求項３】
請求項１に記載の荷電粒子顕微鏡システムにおいて、
前記観察画像より補正用参照画像を短時間で計測することを特徴とする荷電粒子顕微鏡システム。
【請求項４】
請求項１に記載の荷電粒子顕微鏡システムにおいて、
前記観察画像の横方向の歪を補正用参照画像との比較により、前記観察画像の横方向のラインのドリフト量として検出し、前記観察画像の歪を補正することを特徴とする荷電粒子顕微鏡システム。
【請求項５】

請求項１に記載の荷電粒子顕微鏡システムにおいて、
前記観察画像の縦方向の歪を補正用参照画像との比較により、前記観察画像の縦方向のラインのドリフト量として検出し、前記観察画像の歪を補正することを特徴とする荷電粒子顕微鏡システム。
【請求項６】
請求項１に記載の荷電粒子顕微鏡システムにおいて、
前記観察画像の横方向および縦方向のドリフト量において、当該ドリフト量より近似曲線を求め、当該近似曲線から求められたドリフト量を補正量として前記観察画像の歪を補正することを特徴とする荷電粒子顕微鏡システム。
【請求項７】
請求項１に記載の荷電粒子顕微鏡システムにおいて、
前記観察画像のドリフトの有無を操作画面上に表示させることを特徴とする荷電粒子顕微鏡システム。